(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206074710 U
(45)授权公告日 2017.04.05

(21)申请号 201621020763.3

(22)申请日 2016.08.31

(73)专利权人 无锡博一光电科技有限公司
地址 214125 江苏省无锡市滨湖区锦溪路100号

(72)发明人 乔伟雄 高继奎

(74)专利代理机构 无锡华源专利商标事务所（普通合伙）32228
代理人 冯智文 聂启新

(51)Int.Cl.
G01R 31/00(2006.01)

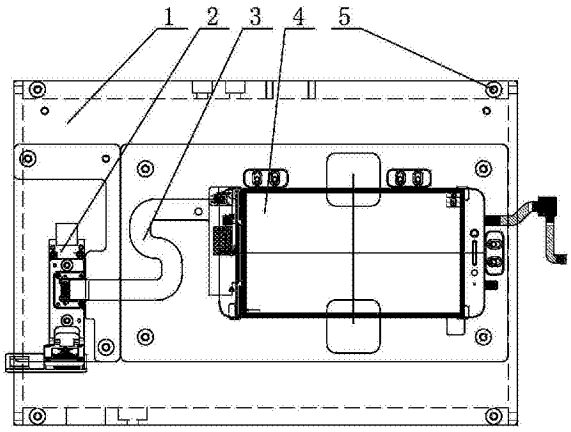
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

针模结构测试架

(57)摘要

本实用新型涉及一种针模结构测试架，包括测试板，所述测试板上表面的一端安装有针模，所述针模上设置有连接卡槽，所述测试板上表面的另一端固定安装产品，所述产品通过卡件卡住，所述产品的一端连接有转接线，所述转接线的头部连接至针模的卡槽中。本实用新型结构紧凑、合理，操作方便，采用针模探针式治具作业，对位简单，检测方便可靠，工作效率高。



CN 206074710 U

1.一种针模结构测试架，其特征在于：包括测试板(1)，所述测试板(1)上表面的一端安装有针模(2)，所述针模(2)上设置有连接卡槽，所述测试板(1)上表面的另一端固定安装产品(4)，所述产品(4)通过卡件卡住，所述产品(4)的一端连接有转接线(3)，所述转接线(3)的头部连接至针模(2)的卡槽中。

2.如权利要求1所述的针模结构测试架，其特征在于：所述测试板(1)成长方形结构。

针模结构测试架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及测试装置技术领域，尤其是一种针模结构测试架。

背景技术

[0002] LCM属于液晶显示器件，广泛使用于手机、数码等终端产品。产品制作出来每PCS都要检测其功能的完整性。需要连接产品的通信接口，传导信号进行点亮测试。

[0003] 现有技术中，测试使用连接器测试，对位存在盲区，容易造成产品通信接口损坏，短路烧坏产品。

实用新型内容

[0004] 本申请人针对上述现有生产技术中的缺点，提供一种结构合理的针模结构测试架，从而对位方便，检测方便，工作效率高。

[0005] 本实用新型所采用的技术方案如下：

[0006] 一种针模结构测试架，包括测试板，所述测试板上表面的一端安装有针模，所述针模上设置有连接卡槽，所述测试板上表面的另一端固定安装产品，所述产品通过卡件卡住，所述产品的一端连接有转接线，所述转接线的头部连接至针模的卡槽中。

[0007] 作为上述技术方案的进一步改进：

[0008] 所述测试板成长方形结构；

[0009] 所述定位孔内开有内螺纹。

[0010] 本实用新型的有益效果如下：

[0011] 本实用新型结构紧凑、合理，操作方便，采用针模探针式治具作业，对位简单，检测方便可靠，工作效率高。

[0012] 本实用新型采用针模的作用，操作方便，快捷，不易出错。

[0013] 本实用新型在实际操作过程中，不易损伤产品连接器卡扣，折弯柔性电路板。

[0014] 本实用型做到标准化，一体化，治具整个接插件使用专用转接线，降低干扰，提高测试效率。

[0015] 本实用新型减少维修频率，降低因对错位损坏产品、测试板因素，省去连接器损耗，节约成本。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0017] 其中：1、测试板；2、针模；3、转接线；4、产品；5、定位孔。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图，说明本实用新型的具体实施方式。

[0019] 如图1所示，本实施例的针模结构测试架，包括测试板1，测试板1上表面的一端安

装有针模2，针模2上设置有连接卡槽，测试板1上表面的另一端固定安装产品4，产品4通过卡件卡住，产品4的一端连接有转接线3，转接线3的头部连接至针模2的卡槽中。

[0020] 测试板1成长方形结构。

[0021] 定位孔5内开有内螺纹。

[0022] 实际操作过程中，将产品4固定在测试板1上，然后测试板1上接上转接线3，转接线3与针模2接通，从而提供信号，对产品进行检测。

[0023] 本实用新型制定LCM通信接口，采用1:1定位接触模型。

[0024] 本实用新型根据通信接口的尺寸，制定1:1的针模针座。

[0025] 本实用新型使用探针针模接触产品提供通信信号，测试产品功能。

[0026] 以上描述是对本实用新型的解释，不是对实用新型的限定，本实用新型所限定的范围参见权利要求，在本实用新型的保护范围之内，可以作任何形式的修改。

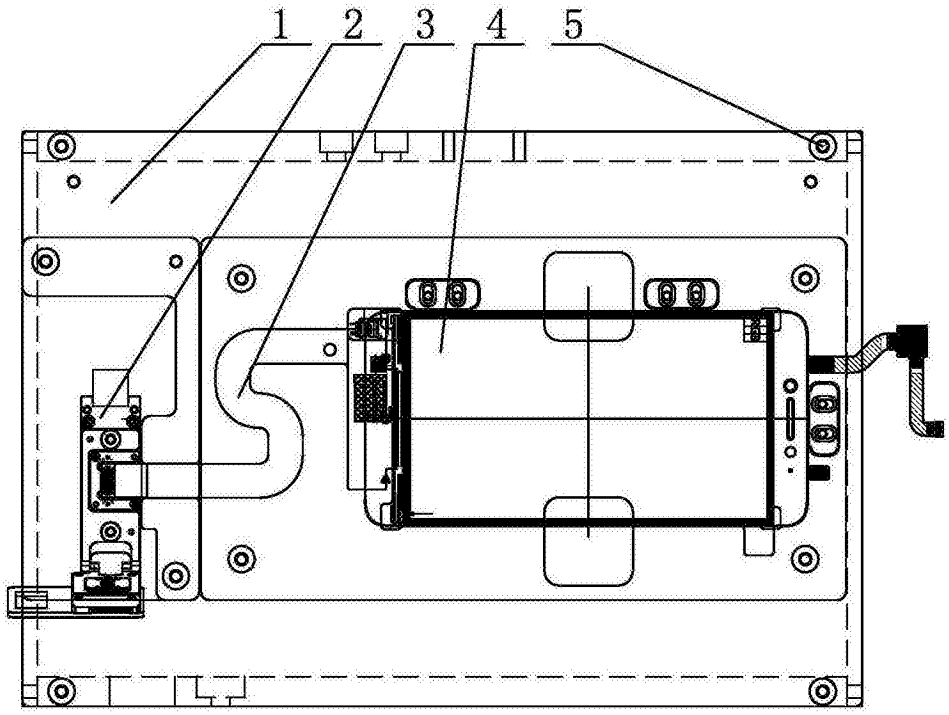


图1